

印刷物表面の無機・有機成分と分布分析 — TOF-SIMS —

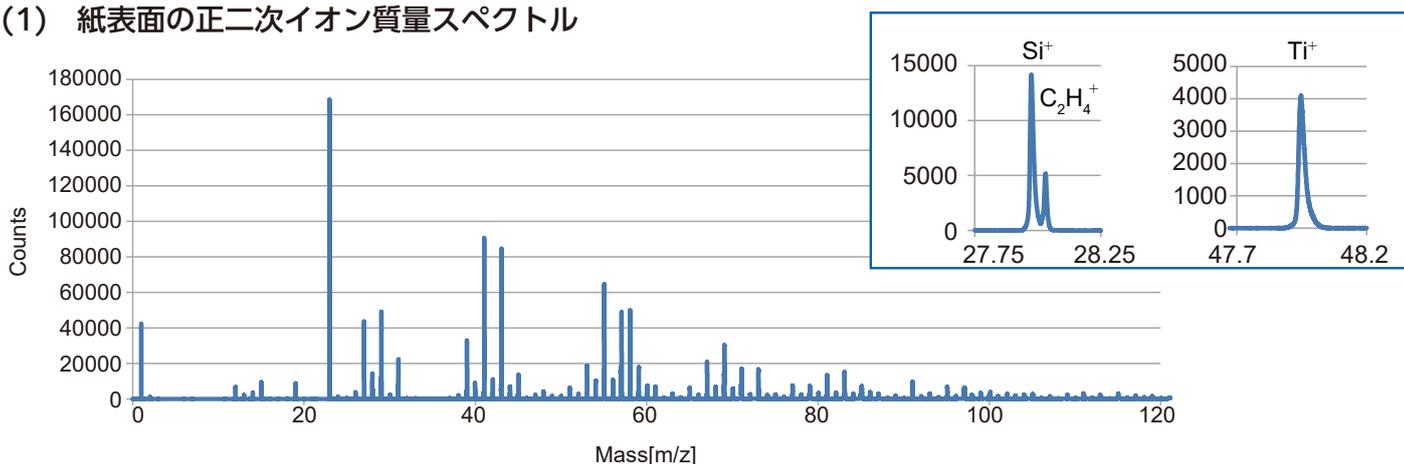
TOF-SIMS 分析では、材料表面に存在する成分の種類や分布を確認することができる。
 印字された紙表面を TOF-SIMS 分析した。紙（セルロース）やトナー由来のイオンが検出され、
 それぞれの成分の広範囲（数 mm 角程度）なマッピング測定が可能である。
 印刷不良などの原因解析に役立てることが出来る。

▶ 分析試料

印刷された紙

▶ 分析事例

(1) 紙表面の正二次イオン質量スペクトル



(2) 紙表面の二次イオン像

